

面电阻测量仪

RC3175/RC2175

面电阻测量仪 0.1-199.9Ohm/sq RC3175。

面电阻测量仪 1-19990Ohm/sq RC2175。

四探针式测量
准确度高
探针光滑
不易划伤膜层
测量速度快



了解详细信息



RC3175

RC2175

RC3175/RC2175探针

本仪器用于测量镀膜玻璃的面电阻或称方块电阻（Ohm/sq.）。

测量对象： 表面导电的Low-E镀膜玻璃
TCO光伏玻璃、ITO玻璃、触摸屏玻璃
透明导电薄膜材料
人工合成金属片及导电纸
其他导电材料

规格参数

项目	RC3175	RC2175
测量范围	0.1~199.9 Ohm/sq	1~19990 Ohm/sq.
分辨率	0.1 Ohm/sq	1 Ohm/sq.
精确性	0.9 %	0.9 %
外形尺寸	115mm × 68mm × 30mm	115mm × 68mm × 30mm
重量	约 150g	约 150g

备注：1、检测过程和读数时都要保持仪器与待测样片充分接触；为提高测量的精确度，最好在离待测样片边缘大于5cm的位置测量。

2、厂家有权修改技术参数，请以实际产品和所附说明书为准。